

# فرمولاسیون، ساخت و خواص سرامیکهای PTCR

## زیارت‌علی نعمتی

قطب علمی فرآیندهای نوین ساخت و شکل دهی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد،  
دانشگاه صنعتی شریف

Nemati@sharif.edu

**چکیده:** در این تحقیق، سنتز سرامیکهای تیتانات باریم همراه با افزودنی سریم انجام گرفت که در آن اثر یون سه ظرفیتی سریم (trivalent) بر روی خاصیت PTCR تیتانات باریم بررسی شد. ابتدا نمونه‌هایی با فرمول کلی  $BaTiO_3$  و با درصد های مختلف سریم (کلرور سریم آبدار) به صورت قرص تهیه و پس از زینترینگ، خواص الکتریکی نمونه‌ها بررسی شد. نمونه‌ها در محدوده دمایی  $135^{\circ}C - 1000^{\circ}C$  زینترینگ و پس از پولیش و الکترود گذاری، خواص الکتریکی آنها در ولتاژ‌های مختلف ارزیابی و رفتار ناحیه PTCR و NTCR و سوئیچینگ خودکار نمونه‌ها بین دو ناحیه به بحث و بررسی گذاشته شد.

از نتایج حاصل مشخص گردید که با افزایش مقدار افزودنی مقاومت ویژه در دمای محیط ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد و در ناحیه  $mol\% = 3/20$  ناخالصی سریم به یک مینیمم می‌رسد. نتایج اندازه‌گیری منحنی جریان-زمان نشان داد که با افزایش ولتاژ اعمالی به نمونه زمان سوییج نمونه از حالت PTCR به NTCR کاهش می‌یابد. تشکیل فاز مزاحم فاز پلی تیتانات با جلوگیری از انجام فرآیند زینترینگ موجب کاهش خواص الکتریکی می‌شود. با توجه به نتایج و بحث شیمی عیوب نتیجه گیری شد که احتمالاً در مرز دانه، عنصر سریم به جای باریم نشسته است (تشکیل جای خالی باریم) و این منطقه از باریم فقیر شده است.

**کلیدواژه‌ها:** سرامیک‌های الکتریکی، تیتانات باریم، اثر PTCR، اکسید سریم، خواص الکتریکی.

## ۱- مروری بر منابع مطالعاتی

سرامیکها در صنایع مختلف مصارف عمده‌ای دارند که در برگیرنده مجموعه وسیعی از سرامیکهای معمولی و سرامیکهای مهندسی تا بکارگیری سرامیکهای مغناطیسی و دیگر سنسورهای سرامیکی و همچنین مصرف قطعات سرامیکی در موتورها می‌باشد. در سه دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه بکارگیری سرامیکها در صنایع نظامی و غیر نظامی حاصل شده است. از جمله مواد نوین، مواد هوشمند می‌باشد. خواص، کاربرد و ویژگیهای مواد هوشمند باعث شده است روز به روز بر اهمیت آنها افزوده شده و تحقیقات علمی و کاربردی فراوانی در خصوص آنها صورت پذیرد.

سرامیکها تقسیم بندی و گروه بندیهای متفاوتی دارند که در منابع ارائه شده است. در این قسمت به بررسی خواص و کاربرد یکی از سرامیکهای الکتریکی اشاره خواهد شد. سرامیکهای بر پایه  $BaTiO_3$  از معروفترین و پرکاربردترین مواد در زمینه قطعات PTCR - NTCR<sup>۱</sup> می‌باشند. این مواد در محدوده‌های معینی از دما و به طور ناگهانی دارای مقاومت ویژه بالا می‌شوند. این اثر شدیداً تحت تاثیر ناخالصی‌ها، افزودنی‌ها و فرآیند تولید می‌باشد. سرامیکهای کریستالی متعددی می‌باشد که دو ساختار مهم آن مکعبی و تتراغونال است. در بالای  $125^{\circ}C$  شکل مکعبی با تقارن مرکزی است و در زیر این دما تتراغونال و بدون تقارن مرکزی است که به همین دلیل دارای پلاریزاسیون دائمی می‌باشد [۱-۳].

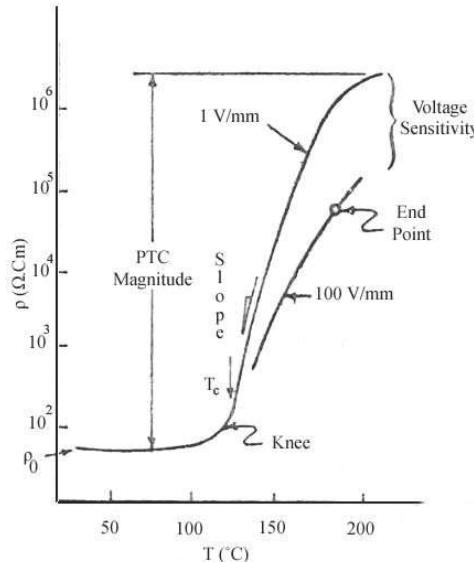
<sup>۱</sup> Positive & Negative Temperature Coefficient of Resistance( PTCR & NTCR)





## ۱-۱-نحوه عملکرد خاصیت PTC در تیتانات باریم

همانطور که اشاره شد این مواد در اثر عبور جریان الکتریکی، مقاومتی از خود نشان میدهند که مقدار این مقاومت با دما متغیر است. از این خاصیت ماده می‌توان برای کاربردهای سوئیچینگ و کنترل خودکار دما و یا مقاومت استفاده کرد. از آنجا که سیستم در دو محدوده PTC و NTC از نظر شیب منحنی دما - مقاومت (شکل) منفی و مثبت است چنانچه سیستم را طوری طراحی کنیم که انتقال مورد نیاز در فرآیند سوئیچینگ با انتقال در دمای کوری ( $T_c$ ) در کنار هم قرار گیرند می‌توان مصارف عمده‌ای را از این فرآیند علمی در صنایع بوجود آورد [۱-۵]. استفاده از مواد PTCR در دهه سال ۱۹۵۰ با کاربردهای حساس به دما شروع شد و با کاربردهای گرمایشی دینامیک که اتلاف انرژی بالای دارند ادامه یافت. تیتانات باریم ( $BaTiO_3$ ) در دمای بالا دارای ساختاری کریستالی پروسکایت است که یون  $Ti^{4+}$  موقعیت بین نشینی مرکزی را درون هشت وجهی اکسیژن اشغال می‌کند، درصورتیکه یونهای  $Ba^{2+}$  در گوشه‌ها قرار می‌گیرند. اندازه کوچکتر یون  $Ti^{4+}$  نسبت به جای خالی هشت وجهی باعث ایجاد موقعیتهایی با انرژی حداقل در مرکز هشت وجهی برای یون  $Ti^{4+}$  می‌شود که درنتیجه ممان دی پل بزرگ و پایدار و پلاریزاسیون خود بخودی در حالت تتراگونال را افزایش میدهد. به همین دلیل، ثابت دی الکتریک  $BaTiO_3$  بالا بوده و بسته به ترکیب و اندازه دانه‌های زینتر شده، در محدوده ۴۰۰۰-۱۵۰۰ قرار دارد. این اثر هم شدیداً تحت تاثیر ناخالصی‌ها و فرآیند تولید می‌باشد [۴-۷].



شکل ۱ طرح شماتیک منحنی دما - مقاومت برای مواد PTC

در منحنی دما- مقاومت (شکل ۱)، چندین نقطه و منطقه مهم وجود دارد که عبارتنداز:

۱- نقطه نهایی که مربوط به تعادل حرارت ایجاد شده در قطعه با حرارت انتقال یافته از قطعه به محیط اطراف خود است. بررسیها نشان داده است که این نقطه تقریباً نزدیکی دمای کوری سیستم می‌باشد.

۲- محدوده PTC [log(R<sub>max</sub>/R<sub>min</sub>)] که هرچه اختلاف حداکثر وحدائق مقاومت الکتریکی بیشتر باشد قابلیت کاری و ضریب اطمینان بیشتر می‌شود.

۳- حساسیت ولتاژ log[R<sub>min</sub>/R<sub>RT</sub>] که نشانگر رفتار سیستم در ناحیه با مقاومت منفی است.

۴- دمای کوری که تقریباً نشان دهنده دمای سوئیچینگ است.

۵- شیب منحنی دما - مقاومت در بالای دمای کوری، که با دو عامل ولتاژ اعمالی و مواد افزودنی قبل کنترل است.

mekanizm fiziki afzayesh naghahani مقاومت به این ترتیب است که در هنگام سرمایش از دمای زینترینگ

جاهای خالی باریم که به عنوان پذیرنده<sup>۱</sup> عمل می‌کنند از مرز دانه به سمت دانه نفوذ می‌کنند و حاملین بار الکتریکی را که در دماهای بالا تولید شده‌اند خشی می‌کنند و به دام می‌اندازنند. بدین ترتیب یک ناحیه عایق در اطراف دانه تشکیل می‌دهند که به صورت لایه نازک در اطراف مرز دانه ایجاد شده و یک لایه تخلیه الکتریکی<sup>۲</sup> ایجاد می‌گردد [۱۰-۵]. وجود مکانهای پذیرنده الکترون که ناحیه عایق را به وجود آورده، به اضافه مکانهای بخشندۀ یونیزه نزدیک مرز، باعث ایجاد یک لایه دوگانه الکتریکی می‌گردد. بنابراین الکترونهای باند هدایت هنگام حرکت از داخل دانه به سمت مرز دانه با یک سد انرژی پتانسیل بزرگ به ارتفاع  $\Phi$  برخورد می‌کند که گذشتن از این ناحیه احتیاج به انرژی بالایی دارد [۱۱-۶]. انرژی لازم برای غلبه بر این سد در دمای پائین بوسیله انرژی پلاریزاسیون تامین می‌شود (زیر دمای کوری) و تا دمای معینی ادامه می‌یابد [۱۲-۶]. افزایش دما باعث کاهش پلاریزاسیون شده و در نتیجه اثر پلاریزاسیون بتدریج کم می‌شود. به مرور با افزایش دما به دمای انتقال یا همان دمای کوری می‌رسیم. هرچه به دمای کوری نزدیک‌تر شویم اثر پلاریزاسیون کاسته می‌شود و با عبور از  $T_c$  سیستم به ساختار مکعبی تبدیل خواهد شد که متقارن است. با توجه به اینکه مرز دانه همچنان به عنوان یک عایق و یا نیمه هادی عمل می‌کند، اما چون پلاریزاسیون نداریم سد پتانسیل موجود در مرز دانه کنترل کننده شده و مقاومت سیستم افزایش می‌یابد [۱۲-۵]. به عبارت دیگر، در بالای دمای کوری که پلاریزاسیون به سمت صفر میل می‌کند مقاومت مرز دانه ای خود را نشان می‌دهد. نگاه ساختاری به این پدیده از مکانیزم تغییرات مقاومت - دما بدین ترتیب صورت می‌گیرد که اگر چند ذره را در نظر بگیریم مابین ذرات توسط مرز دانه‌های پوشیده شده است. همانطور که گفته شد در برابر هدایت ذرات در مرز دانه یک مانع بزرگی برای هدایت بوجود می‌آید که به خاطر ساختار متفاوت در مرز دانه و پدیده جدایش فازی، تمرکز ناخالصیها در مرز دانه‌هاست. لذا در مرز دانه‌ها سد پتانسیلی تشکیل می‌شود و هر زوج دانه شرایط نیمه هادی - عایق - نیمه هادی و یا هادی - هادی - نیمه هادی به خود می‌گیرد. تقویت کننده‌های با طرفیت چندگانه (+۵ و +۳) مانند La, Sb, Nb<sup>۳+</sup> و +۷ با جایگزینی در مکانهای Ba و Ti<sup>۴+</sup> کنترل کننده خاصیت نیمه هادی بوده و موجب تغییر مقاومت سیستم می‌شوند. به همین دلیل هموزن سازی ساختار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بهترین روش برای همگن سازی و ساخت ترمیستور PTC روش‌های سل ژل<sup>۵</sup>، هم رسوبی<sup>۶</sup> و خشک کردن پاششی<sup>۷</sup> می‌باشد. نتیجه بکارگیری این روش‌ها دستیابی به ساختار بسیار همگن و یکنواخت، توزیع مناسب افروزنی تقویت کننده و سیستم تکفار می‌باشد [۸-۱۲].

## ۱-۲- نقش مواد افزودنی:

در منابع متعدد علمی این مسئله یعنی نقش مواد افزودنی مطالعه و بررسی شده است که خلاصه آنها در اینجا ارائه شده است [۱۸-۵].

- افزودنیهای هم طرفیت (Isovalent dopants):

جایگزینی عناصری مثل (Sr, Ca, Pb) باعث تغییراتی در دماهای ساختار تبدیل ساختار می‌گردد (شکل ۲). چنانچه ملاحظه می‌گردد Ca تاثیر چندانی بر دمای کوری (۱۲۵°C) ندارد ولی باعث بهبود اندازه دانه و ریز ساختار می‌گردد. از طرفی Pb دمای کوری را افزایش ولی Sr آن را کاهش می‌دهند.

- افزودنیهای با طرفیت چندگانه (Altervalent dopants):

با اضافه کردن تقویت کننده‌ای مثل La<sup>3+</sup> نیمه هادی نوع n حاصل می‌شود. بنابراین برای اینکه تعادل بار

<sup>2</sup> Acceptor

<sup>3</sup> Depletion layer

<sup>4</sup> Sol-gel

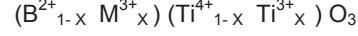
<sup>5</sup> Coprecipitation

<sup>6</sup> Spray Drier





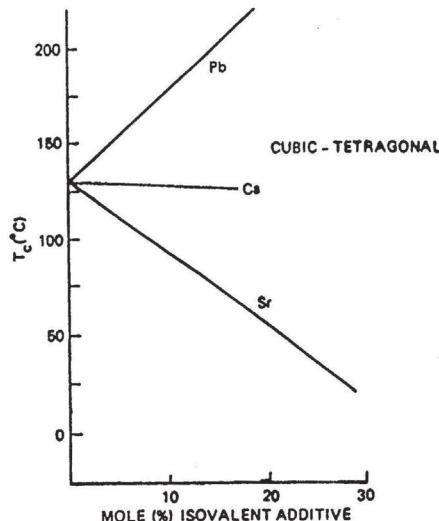
الکتریکی به هم نخورد از لحاظ شیمیایی به ازای هر یون سه ظرفیتی یک  $Ti^{3+}$  جایگزین یک یون  $Ti^{4+}$  در شبکه پروسکایت می‌گردد که فرمول کلی سیستم به این صورت در می‌آید:



که  $X$ ، مقدار جایگزینی افزودنی  $M^{3+}$  سه ظرفیتی می‌باشد. البته می‌توان از تقویت کننده‌های پنج ظرفیتی که با  $Ti^{4+}$  جایگزین شوند هم استفاده کرد. بررسی‌های به عمل آمده نشان داده است که حداقل مقاومت در محدوده ( $0/۳-۰/۲$ ) درصد غلظت مولی عناصر جایگزین شده در دمای محیط مشاهده می‌گردد.

#### - اصلاح کننده‌های لایه سد شاتکی:

بررسی‌ها نشان داده است که برخی از یون‌های فلزی انتقالی، خصوصاً آنهایی که دارای تغییر ظرفیت هستند مانند  $Cr$ ,  $Fe$ ,  $Mn$  باعث افزایش اثر PTC می‌گردند. بررسی دانه‌ها و فاز‌های ثانویه در مرز دانه نشان می‌دهد که بخش عده‌ای از اضافه شونده‌ها و  $Ti$  اضافی و  $Si$  در فازهای مرز دانه ای تجمع پیدا می‌کنند. این فازهای ثانویه علاوه بر کمک به زیترینگ، اثرات دیگری هم دارند که از جمله این است که ناخالصی‌های مضر دیگر را جمع آوری نموده و در فازهای مرز دانه ای متتمرکز می‌کنند. به عنوان مثال فاز مذاب سیلیکاتی حاوی Ba-Ti باشد میزان خوبی برای قلیائی‌ها و قلیائی‌های خاکی و دیگر مواد مضر برای PTC می‌باشد.



شکل ۲- اثر مواد افزودنی در دمای کوری سیستم

## ۲- اهداف و روش تحقیق

در این تحقیق، فرمولاسیون و ساخت یک نوع سرامیک هوشمند، که همان سرامیک تیتانات باریم با افزودنی‌های خاص است انجام گرفت. مواد اولیه مصرفی شامل پودرهای  $BaCO_3$  و  $TiO_2$  از شرکت مرک آلمان با خلوص آزمایشگاهی بالا ( $>99/9\%$ ) و  $CeCl_3 \cdot 7H_2O$  محصول شرکت Fluka با خلوص بالا بود. مواد اولیه فوق برای رسیدن به استوکیومتری  $TiO_2/BaCO_3 = 1/0.1$  درصد مولی  $TiO_2$  اضافی جهت کمک به بهبود زیتر پذیری) باهم ترکیب شدند. برای افزایش یکنواختی سیستم از روش هموزن سازی حالت ترو و تهییه دوغاب توسط الکل و سپس همزدن و خشک کردن مناسب استفاده شد. به همین دلیل، عمل اختلاط در چندین مرحله و به صورت خشک و تر صورت گرفت تا همگنی سیستم بهبود یابد. روش اختلاط پودرها به این ترتیب بود که ابتدا پودرهای  $BaCO_3$  و  $TiO_2$  بهمراه مقدار لازم از افزودنی ( $CeCl_3 \cdot 7H_2O$ ) ( $0/1$ ،  $0/2$ ،  $0/3$ ،  $0/4$ ،  $0/5$  درصد مولی) و یک درصد مولی  $TiO_2$  اضافی همراه با الکل صنعتی (الکل متیلیک) همzده شد تا یک سوسپانسیون (دوغاب) به دست آید. سپس سوسپانسیون در دمای

۱۵۰ °C-۲۰۰ °C در داخل یک بوته آلومینیمی ریخته شد و سپس به مدت ۳ ساعت و در مای ۱۱۵۰ °C قرار داده شد. پس از سرد شدن، توسط آسیاب لرزشی خرد شد. چسب مصرفی PVA بود که به مقدار ۰/۳٪ وزنی به پودر اضافه شد. برای به دست آمدن فشار بهینه در پرس نمونه هایی با فشار های متفاوت (معادل ۱۰ تا ۳۵ تن بر سطح مقطع نمونه ها) پرس گردید. پرس مورد استفاده پرس تک محوری و از یک قالب فولادی استفاده شد. نمونه ها به شکل قرص و با ابعاد قطر ۲/۸ mm و ضخامت ۷ mm آماده شدند. نمونه ها در دماهای ۱۱۰ °C تا ۱۳۵°C زیستر و مدت زمان ۲ ساعت در دمای ماکریزم نگهداری شدند تا واکنش های احتمالی به صورت کامل انجام گیرد. برای خروج رطوبت و بایندر نیز یک ساعت در دمای ۵۵°C توقف وجود داشت. سرعت گرم کردن به طور تقریبی  $200^{\circ}\text{C}/\text{hr}$  و سرد شدن نمونه ها در داخل کوره صورت گرفت. برای اندازه گیری دانسیته و تخلخل ظاهری از روش ارشمیدس استفاده شد. پس از این مرحله سطح نمونه ها پولیش و الکترودگذاری شد. از پوشش طلا برای این منظور استفاده شد. تغییرات مقاومت و جریان عبوری از نمونه ها در ولتاژهای مختلف و در درجه حرارت های متفاوت اندازه گیری شد.

پس از تهیه نمونه ها و الکترودگذاری، خواص الکتریکی آنها در ولتاژهای مختلف بررسی و رفتار الکتریکی آنها و سوئیچینگ آنها در حالت PTC و NTC به بحث و بررسی گذاشته شد. برای اندازه گیریهای الکتریکی، نمونه ها توسط چسب نقره کنتاکت گذاری شدند. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص از دستگاه مقاومت سنج ساخت آلمان Megger (AVO Tech) استفاده شد. دامنه اندازه گیری این دستگاه از ۰/۰۱ مگا اهم تا ۱۰۰ گیگا اهم بود و چون اندازه گیری مقاومتها کمتر از یک صدم مگا اهم توسط این دستگاه مقدور نبود، بنابراین از یک دستگاه مولتیمتر آنالوگ نیز برای اندازه گیری مقاومتها کمتر از ۱ مگا اهم استفاده شد. مقاومت ویژه نمونه ها از دمای محیط تا حوالی ۳۰۰ درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. برای اندازه گیری منحنی جریان- زمان از یک منبع تغذیه که می توانست ولتاژهای متفاوت ایجاد نماید استفاده شد. جریان عبور کننده از نمونه نیز توسط یک میلی آمپر سنج با فاصله زمانی یک ثانیه اندازه گیری شده و ثبت گردید. حداقل ولتاژ اعمال شده به نمونه ها ۲۵ ولت و حداکثر ۳۰۰ ولت بود. برای انجام آنالیز کیفی و نوع فازهای موجود و اطمینان از انجام واکنش تیتان و کربنات باریم و تشکیل تیتانات باریم الگوی تفرق اشعه ایکس نمونه ها به دست آمد. بررسی ریز ساختار نمونه ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز فازی توسط صورت گرفت XRD.

### ۳- نتایج و بحث

#### ۳-۱- بحث و بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ساخت و نقش مواد اولیه

خلوص مواد اولیه یکی از عمدۀ ترین مسایل در ساخت قطعات PTCR می باشد. همانطور که در منابع ذکر شده [۱-۵]، مقادیر بسیار کم از ناخالصی ها می تواند خواص نمونه را تحت الشاع قرار دهد. با توجه به اینکه مواد اولیه مورد استفاده در این پژوهش محصول شرکت مرک آلمان بوده و خلوص بسیار بالای داشت بنابراین احتمال وجود ناخالصی در سیستم بسیار کم می باشد. علت پایین بودن دمای زینترینگ علی رغم عدم حضور ناخالصیها، وجود  $\text{TiO}_2$  اضافی می باشد که موجب کاهش دمای پخت شده است. بدون حضور  $\text{TiO}_2$  اضافی زیستر حتی تا دماهای ۱۴۵۰ °C نیز مشکل است. این نکته در مراحل مختلف نیز ذکر شده است [۱-۱۰]. این مسئله در دیاگرام فازی شکل (۳) نشان داده شده است.

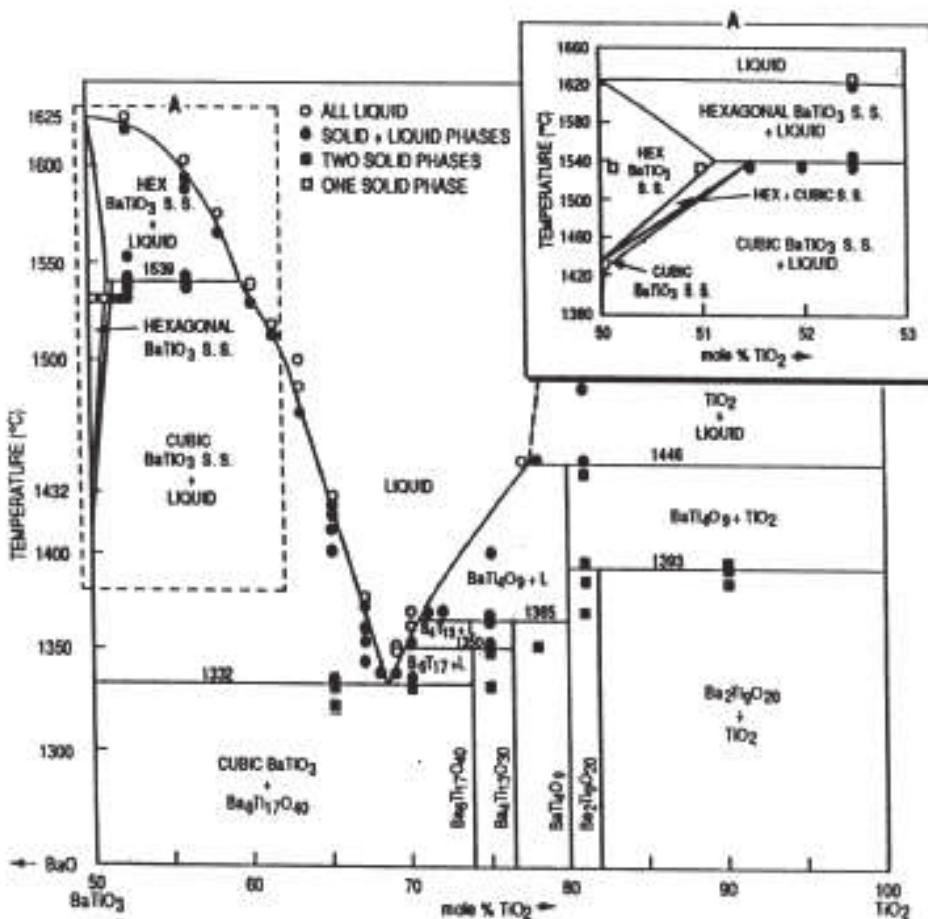
سعی شد که از روش اختلاطی استفاده شود که حداقل یکنواختی را ایجاد نماید و در عین حال از روش اختلاط پودر در حالت خشک نیز مؤثرتر باشد. بنابراین از روش تهیه و آماده سازی دوغاب توسط الکل و سپس همزدن و خشک کردن مناسب استفاده شد. یکی از روشهای کنترل این مسئله، اندازه گیری مقاومت

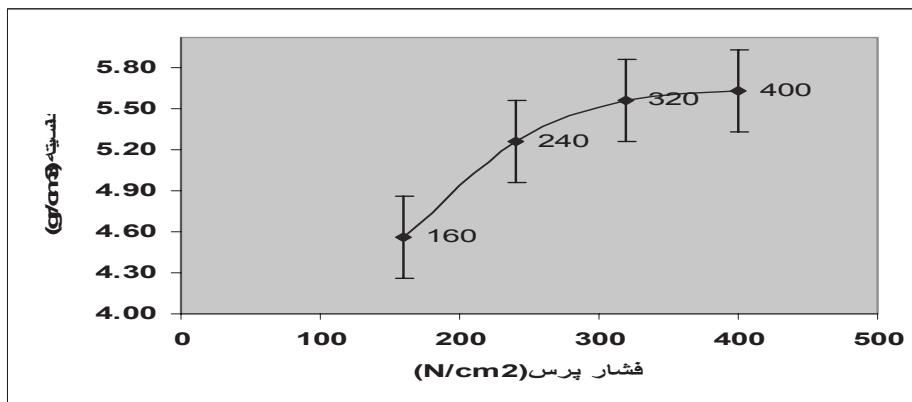




نمونه ها در دمای محیط (پس از زینتریگ در دمای بالا) و نزدیکی اعداد به یکدیگر است که با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتایج گرفت که سریم به طور مناسبی یکسان توزیع شده است. البته بررسیهای تکمیلی که در اینجا نتایج آن ارائه نشده است و فقط در بحث شیمی عیوب کمی به آن پرداخته شده است نشان داد که ممکن است مقداری از سریم وارد شبکه پروسکایت نشده و در مرز دانه دانه ها متمرکز شود که این مسئله می تواند در رفتار کلی سیستم موثر باشد. البته این پدیده در دیگر مواد افزودنی هم مشاهده شده است [۲۱-۲۲].

فشار پرس در حین شکل دهی میتواند روی دانسیته خام اولیه و همچنین دانسیته نهایی تأثیر مهمی داشته باشد. هر چه فشار اولیه پرس بیشتر باشد نمونه های نهایی تخلخل کمتری را خواهند داشت البته فشار پرس یکی از چند عاملی است که روی دانسیته نهایی تأثیر گذار است. فشار پرس برای نمونه باید یک مقدار اپتیمم داشته باشد زیرا اگر از یک حد بیشتر شود با عیوب پرس از قبیل لایه ای شدن نمونه ها بعد از زینترینگ مواجه خواهیم شد. در این پژوهش از فشارهای متفاوتی استفاده شد و مشخص گردید که بهترین فشار، فشار حدود  $400 \text{ N/cm}^2$  می باشد. فشارهای بیشتر از این مقدار در شکل دهی نمونه هاباعث ایجاد عیوب بعد از پرس شده و در فشار های کمتر نیز، دانسیته بعد از پخت پایین بود. همچنین با توجه به نمودار تغییرات دانسیته بر حسب فشار پرس بعد از پخت نمونه ها میتوان به نقش تغییر فشار در دانسیته نهایی پی برد (شکل ۴). با افزایش فشار دانسیته به یک اپتیمم رسیده و سپس با افزایش بیشتر نمونه ها دارای عیوب و شکل ظاهری بد بعد از پرس(کندگی سطوح و ترک لایه ای) می شود.

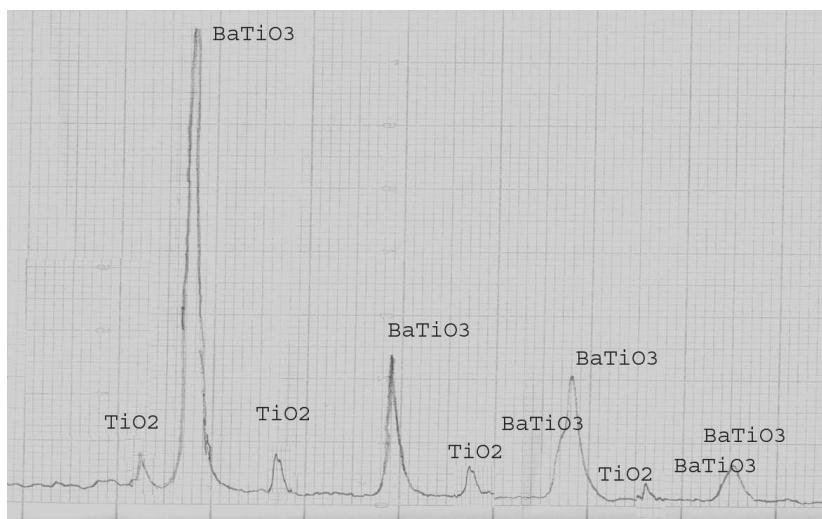




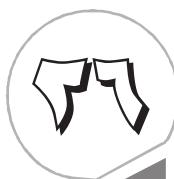
شکل ۴- تغییرات دانسیته بعد از پخت بر حسب فشار پرس

### ۳-۲-بحث و بررسی ریز ساختاری و فازی

جهت بررسی مرحله به مرحله پیشرفت زینترینگ، بررسی فازی مخلوط پودری قبل و بعد از هر مرحله زینترینگ بررسی شد. بررسی ها نشان داد که پس از عملیات حرارتی در دمای  $1150^{\circ}\text{C}$ ، واکنش پودرها با یکدیگر شروع شده است لکن در این دما و زمان بکار رفته هنوز مقداری  $\text{TiO}_2$  و  $\text{BaO}$  واکنش نکرده باقیمانده است. پیکهای مربوط به  $\text{BaO}$  بعلت تلاقي با پیکهای تیتانات باریم قابل تشخیص نبودند (در مقایسه با پیکهای مربوط به  $\text{BaO}$  خالص). امکان تشخیص اکسید سریم نیز به علت مقدار جزیی آن از این طریق میسر نمی باشد. در شکل (۶) آنالیز فازی سیستم، پس از زینترینگ در دمای  $1150^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد نشان داده شده است. همانگونه که انتظار می رفت با افزایش درجه حرارت (در دمای  $1350^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد - شکل ۷)، علاوه بر تشکیل فازهای اصلی در سیستم، احتمال تشکیل فازهای مرزدانه ای خاص (پدیده جدایش فازی در سرامیک های الکتریکی) و تغییر خواص الکتریکی نیز صورت می گیرد که با روش اشعه ایکس قابل شناسائی نیستند. در مقایسه با پیکهای تیتانات باریم خالص (شکل ۸) تشکیل کامل تیتانات باریم در سیستم مورد مطالعه تأیید شده است.

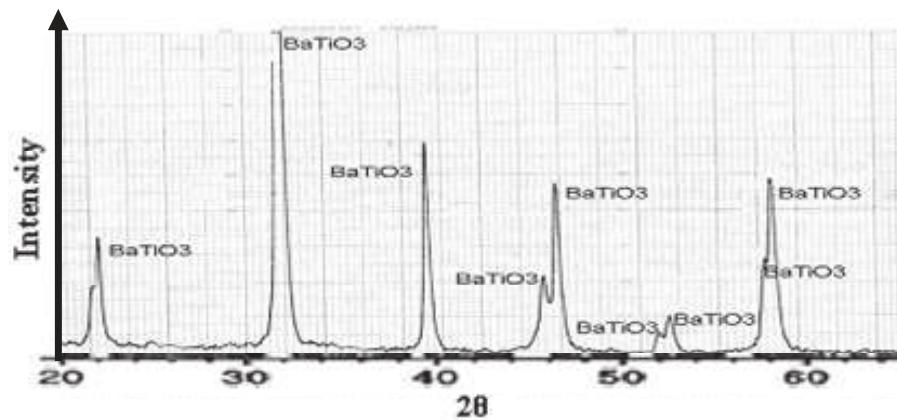
شکل ۶- آنالیز فازی سیستم پس از زینترینگ در دمای  $1150^{\circ}\text{C}$ 

مسئله مهم دیگر در این سیستم، کنترل فرآیند ساخت در راستای رسیدن به سیستم تک فاز می باشد. در بررسی برخی از نمونه ها که اتفاقاً خوب زینتر نشده بودند متوجه تشکیل فاز پلی تیتانات باریم شدیم که در شکل (۹) نشان داده شده است. بررسی های تکمیلی محقق که در اینجا ارائه نشده است نشان داد که علت

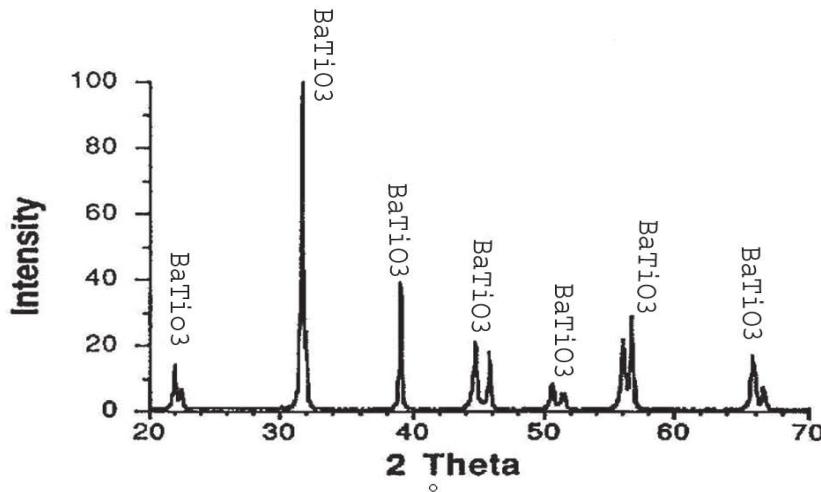




وجود فاز پلی تیتانات،  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$  (B6) که در دمای  $1332^{\circ}\text{C}$  رخ می‌دهد (به شکلهای ۳ و ۶ رجوع شود) و توسط محققان دیگر هم گزارش شده است احتمالاً وجود تیتان اضافی و عدم همگنی پودر اولیه و توزیع غیر یکنواخت  $\text{TiO}_2$  در پودر اولیه می‌باشد. یکی از اثرات مشهود حضور این فاز به تعویق انداختن زینترینگ می‌باشد زیرا با تشکیل این فاز راه‌های نفوذ اتم‌ها بسته می‌شود و از انجام فرآیند زینترینگ ممانعت بعمل می‌آید. البته دلیل دیگر تشکیل این فاز می‌تواند (احتمالاً) وجود گرادیان دمایی در داخل کوره و نرسیدن به دمای مناسب زینترینگ باشد. الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) نمونه Ce ۰/۴ mol% پس از عملیات حرارتی در  $1350^{\circ}\text{C}$  وجود این فاز را تأیید می‌کند. لازم بتذکر است که تشکیل این فاز توسط دیگران نیز گزارش شده است [۲۲-۲۳].



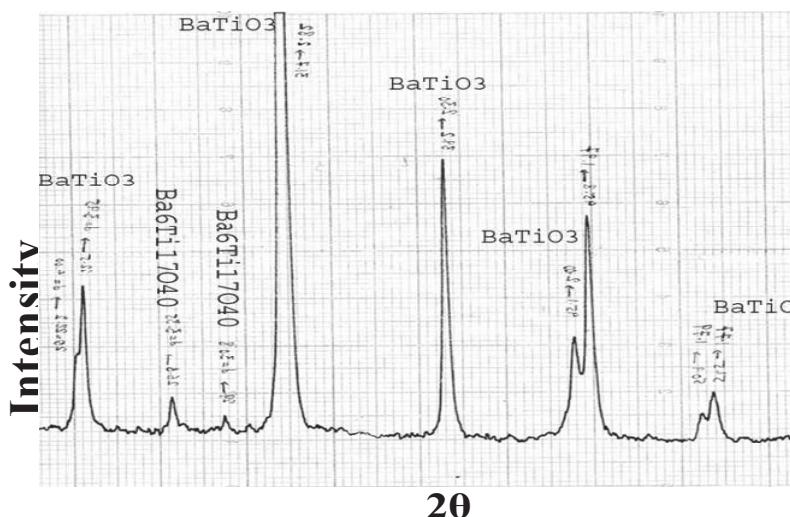
شکل ۷- آنالیز فازی سیستم پس از زینترینگ در دمای  $1350^{\circ}\text{C}$



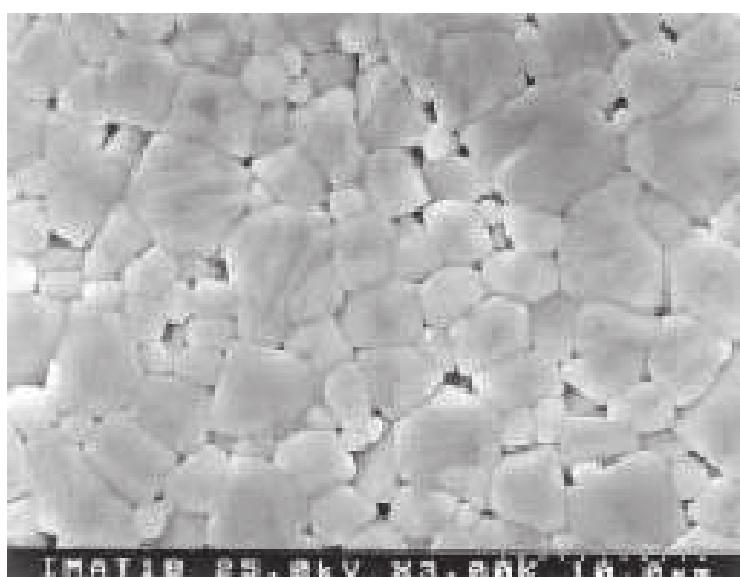
شکل ۸- لگوی تفرق اشعه X برای  $\text{BaTiO}_3$  خالص [۱۲]

همچنین ریز ساختار یکی از نمونه‌های ساخته شده که بوسیله میکروسکوپ الکترونی بررسی شده در شکل (۱۰) ارائه گردیده است. بررسی‌های بیشتر که توسط محقق صورت گرفته نشان داده است که در ریز ساختار نمونه و در نواحی مرزدانه‌ای جدایش فازی رخ داده است و عناصر Ti و Ce در نواحی مرزدانه‌ای متتمرکز شده و این ناحیه از Ba راقیق شده است. این مسئله در راستای مشاهدات محققین دیگر می‌باشد [۱۱-۱]. این مسئله منجر به تغییر خواص نواحی فصل مشترک و مرزدانه‌ای می‌گردد که این نیز به نوبه خود خواص الکتریکی سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به این که پدیده PTCR یک پدیده مرز دانه ایست بنابراین هر چقدر مرز دانه بیشتری داشته باشیم کیفیت و رفتار نمونه‌های PTCR بهتر می‌شود. با توجه به

ابعاد دانه در نمونه های مورد مطالعه و فازهای مرز دانه ای تشکیل شده، می توان نتیجه گیری نمود که یکی از دلایل دست یافتن به شب مناسب در منحنی مقاومت ویژه – دما به دلیل ماهیت فازهای مرز دانه ای است. زیرا این شب بستگی به ابعاد دانه و خصامت لایه سدی ایجاد شده در حین فرآیند زینترینگ در مرز دانه دارد.[۴]



شکل ۹- تشکیل فاز پلی تیتانات باریم در نمونه های خوب زینتر نشده



شکل ۱۰ - ریز ساختار نمونه زینتر شده در دمای  $1350^{\circ}\text{C}$  که بوسیله میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است

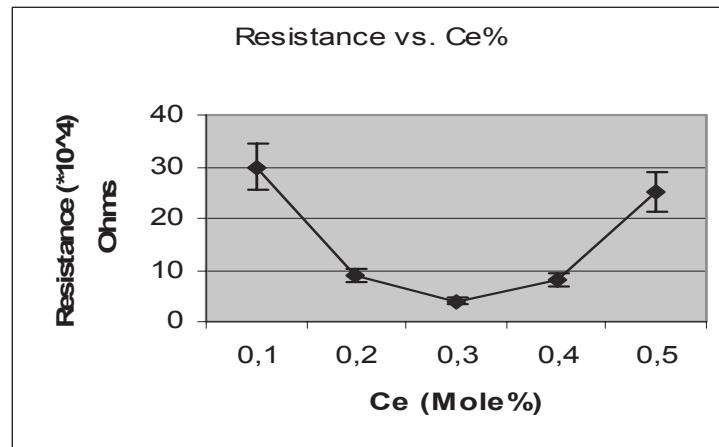
### ۳-۳- بحث و بررسی خواص الکتریکی

اندازه گیری های الکتریکی در نمونه هایی انجام گرفت که واکنش شیمیایی آنها کامل شده بود ( بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فازی توسط XRD ). در شکل (۱۱) منحنی تغییرات مقاومت الکتریکی در دمای اتفاق بر حسب درصد اکسید سریم در نمونه زینتر شده در  $1350^{\circ}\text{C}$  نشان داده شده است. در خصوص ارزیابی اثر مقدار افزودنی، مقاومت دمای محیط (R-T) نمونه ها به عنوان تابعی از غلظت افزودنی، در شکل (۱۱) نشان داده شده است. این منحنی نشان می دهد که مقاومت R-T با افزایش میزان ماده افزودنی تقویت کننده در مقادیر کم ناچالصی کاهش می یابد و در میزان  $\text{Ce}^{3\text{mol}\%}$  به یک مینیمم می رسد،

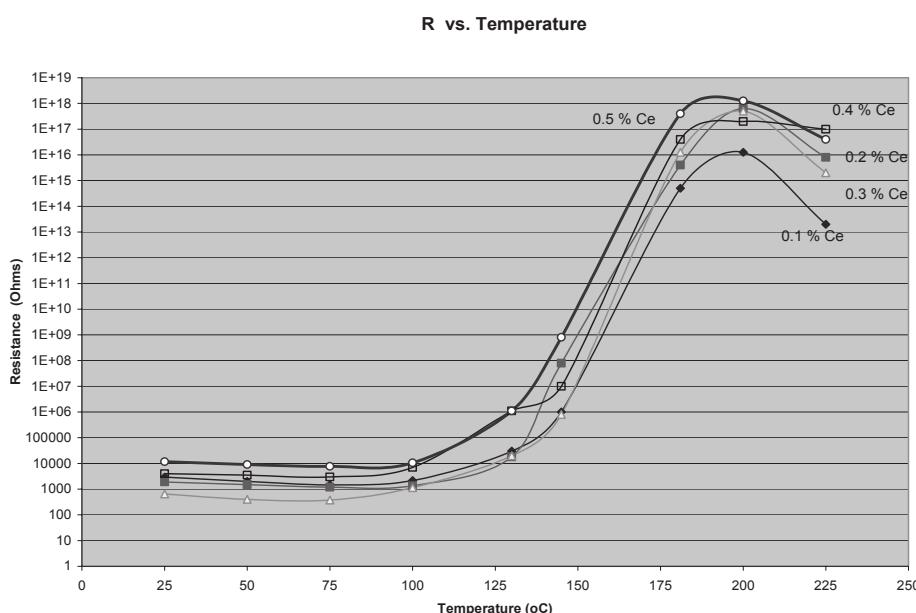




سپس با افزایش میزان افزودنی افزایش می‌یابد. از آنجا که مقاومت در دمای اتان، عمدتاً بوسیله رفتار و خواص الکتریکی دانه‌ها (نیمه‌هادی بودن آنها) کنترل می‌شود میتوان استنتاج نمود که مقداری از ناخالصی دوب پ شده به درون دانه‌های تیتانات باریم عایق نفوذ کرده و آنرا نیمه‌هادی نموده است. ظاهراً تغییر و کاهش مقاومت دمای اتان تا  $0/3$  درصد مولی (شکل ۱۱) ادامه داشته و در مقادیر بیشتر، عمدتاً در نواحی مرز دانه‌ای متوجه کردن شده و مقاومت مرز دانه‌ای را افزایش داده است. به همین دلیل، مقاومت سیستم در دمای اتان مجددًا افزایش می‌یابد. مشابه این رفتار توسط محققان دیگر نیز که از افزودنی‌های مختلف استفاده کرده اند نیز مشاهده شده است [۱-۱۲].



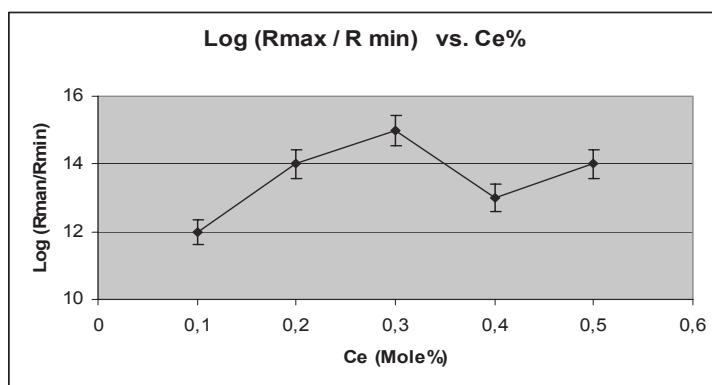
شکل ۱۱ - نمودار مقاومت ویژه در دمای محیط برای درصد های مختلف Ce



شکل ۱۲ - نمودار تغییرات مقاومت بر حسب دما برای درصد های مختلف اکسید سریم

بررسی‌های میکروسکوپی و فازی به عمل آمده در این تحقیق و اندازه گیری‌های الکتریکی صورت گرفته و مطالعات مشابه که با استفاده از ناخالصی‌های دیگر انجام شده است [۵-۱۵] نشان داده است که مقداری از Ce به درون سیستم پروسکایت نفوذ کرده و آن را تبدیل به یک نیمه‌هادی می‌کند (به قسمت بحث شیمی عیوب رجوع شود) که ظاهراً ذرات نیمه‌هادی نوع  $n$  ایجاد می‌کند. باقیمانده Ce در نواحی مرزدانه ای

متوجه کز می شوند که بررسی های دقیق تری می طلبند تا مشخص گردد که آیا مرزدانه ها خواص نیمه هادی دارند و یا رفتار عایق از خود بروز می دهد. در هر دو صورت، از مرکز یک دانه تا مرکز دانه مجاور می توانیم یکی از دو مدل را مد نظر قرار دهیم. یا به صورت اتصال دو نیمه هادی به نیمه هادی نوع سوم (اگر مرز دانه را نیمه هادی در نظر بگیریم) و یا به صورت اتصال دو نیمه هادی به فاز عایق (اگر مرز دانه را عایق در نظر بگیریم).



شکل ۱۳ - لگاریتم مقاومت ماکریزم به مقاومت مینیمم به ازاء مقادیر مختلف افزودنی

تغییرات مقاومت نمونه های زینتر شده در دیگر درصد های مختلف اکسید سریم بر حسب دما اندازه گیری شد که نتایج حاصل در شکل (۱۲) ارائه شده است. بر این اساس، دمای کوری  $T_C$  حدود  $125^{\circ}\text{C}$  تعیین گردید.

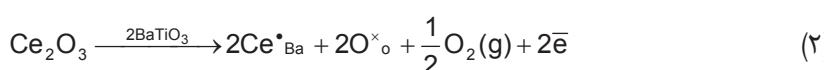
با استفاده از مدل های تئوریک که قبلاً به آنها اشاره شد [۱-۵]، تغییرات  $\log(R_{\text{max}}/R_{\text{min}})$  بر حسب درصد اکسید سریم محاسبه و رسم گردید که در شکل (۱۳) ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود حداقل افزایش مربوط به نمونه حاوی  $\text{CeO}_2$  درصد می باشد.

#### ۳-۴- بررسی مکانیزم و نحوه عملکرد یونهای سریم

جهت بررسی مکانیزم و نحوه عملکرد سریم، ناگزیر از ارزیابی شیمی عیوب در سیستم و ارائه مدلی برای توجیه رفتار آن می باشیم. بنظر می رسد که یا تمامی کاتیونهای سریم بصورت سه ظرفیتی هستند و اگر هم درصدی از آن چهار ظرفیتی باشد طی واکنش ذیل ابتداء به سریم سه ظرفیتی تبدیل می شود.



سپس، با توجه به واکنش های پیش بینی شده در مبحث شیمی عیوب، در مقادیر کم ناخالصی کاتیونهای سریم در مکانهای باریم می نشینند.



برای حفظ خنثائی الکتریکی و تعادل جرمی در ساختار و با محاسبه ثابت تعادل از دو معادله بالا چنین خواهیم داشت:

$$[\text{Ce}_{\text{Ba}}^{+}] = [\bar{e}] \quad (3)$$

از آنجا که هدایت الکتریکی ذرات توسط معادله زیر به غلظت الکترونها مربوط می شود:

$$\sigma = n e \mu \quad (4)$$

که در آن  $\sigma$  هدایت ماده،  $n$  غلظت ناقلهای الکتریکی و  $\mu$  قابلیت حرک آنهاست. بنابراین مقاومت دمای محیط با افزایش میزان سریم (افزومنی دونر و یا دهنده الکترون) کاهش می یابد. وقتی میزان سریم از یک حد بیشتر می شود دو حالت می توانند اتفاق بیفتد. کاتیونهای  $\text{Ce}$  یا می توانند جای خالی باریم در سیستم





تولید نماید که رابطه مربوطه بشرح ذیل می باشد [۶] :



و یا می توانند مکانهای Ti را اشغال کرده و نقش افزودنی پذیرنده را ایفا کند :



بنابراین غلظت الکترون های آزاد در هر دو حالت کاهش می یابد. زیرا در حالت اول الکترونها توسط جاهای خالی باریم به دام می افتد و در حالت دوم نیز الکترون ها به دلیل جانشینی سریم در مکانهای Ti کاهش می یابند.

در همین رابطه، اثر اتمسفر زینترینگ و سرعت سرمایش نمونه ها نیز حائز اهمیت می باشد. بررسی ها نشان داده است که وقتی  $\text{BaTiO}_3$  خالص در هوا زینتر می شود واکنش زیر اتفاق می افتد [۱-۷] :



به دلیل فشار بالای اکسیژن در مرز دانه ها، وقتی نمونه در هوا زینتر می شود این واکنش ترجیحاً در مرز دانه به جای داخل شبکه به وقوع می پیوندد. لذا جای خالی باریم خنثی میتواند توسط الکترونها فراهم شده توسط افزودنی دهنده (سریم)  $\text{Ce}$  مطابق رابطه (7) یونیزه شود:



بر طبق نظریه های مطرح شده در تئوری رفتار PTCR در سرامیکهای  $\text{BaTiO}_3$  دوپ شده توسط افزودنی دهنده الکترون (Donor)، به دام افتادن الکترون آزاد توسط جاهای خالی باریم در مرز دانه ها در حین تحول فازی فرو الکتریک علت اصلی خاصیت PTCR است [۱-۷]. در این شرایط، اثر PTCR توسط غلظت جاهای خالی خنثی باریم نمونه ها در دمای پایین مشخص می شود. از معادلات (8) و (9) می توان دریافت که با افزایش میزان ناخالصی سریم، غلظت جای خالی باریم خنثی در مقادیر زیاد افزودنی کاهش می یابد. جای خالی باریمی که توسط مقادیر بیش از حد Ce تولید می شود نمی تواند خاصیت PTCR را تقویت کند (مقاومت دمای محیط را نمی تواند کاهش دهد و یا افزایش مقاومت در ناحیه PTCR را زیاد کند)، زیرا به صورت یونیزه می باشد (معادله ۴). بنا براین این جای خالی نمی تواند به عنوان دام برای گیر انداختن الکترون های آزاد عمل کند. فشار اکسیژن بالا میتواند از یونیزه شدن جاهای باریم خنثی جلوگیری نموده (معادله ۹)، همچنین می تواند جاهای خالی باریم خنثی بیشتری در مرز دانه ها تولید نماید (معادله ۷). بنابر بحث فوق می توان نتیجه گرفت که علت کاهش و سپس افزایش مقاومت دمای محیط نمونه ها دلایل فوق است. بر اساس منابع موجود مقاومت دمای اتاق اساساً به عواملی چون میزان و نحوه توزیع افزودنی تقویت کننده (سریم)، دمای زینترینگ و میزان تخلخل بستگی دارد. علاوه بر این، شب منحنی PTCR نیز بستگی به سرعت سرمایش (عبور از ناحیه اکسیداسیون) و سایر عوامل همچون میزان تیتانیم اضافی ارتباط خواهد داشت.

#### ۴- نتیجه گیریها

- در این تحقیق سرامیک های الکتریکی PTCR از تیتانات باریم همراه با مواد افزودنی زینتر گردید که در فرمولاسیون طراحی شده دمای زینترینگ  $1350^{\circ}\text{C}$  بود.
- با توجه به نمودار تغییرات دانسیته بر حسب فشار پرس میتوان گفت با افزایش فشار، دانسیته به یک اپتیمم می رسد.
- وجود فازهای مزاحم مانند فاز پلی تیتانات با جلوگیری از انجام فرآیند زینترینگ موجب کاهش خواص

الکتریکی می‌شود. این فاز غنی از تیتانیم است و علت اصلی تشکیل آن عدم توزیع مناسب Ti و غیر همگنی پودر است.

- با توجه به نتایج و بحث شیمی عیوب نتیجه گیری شد که احتمالاً در مرز دانه، عنصر سریم به جای باریم نشسته است (تشکیل جای خالی باریم) و این منطقه از باریم فقیر شده است.
- مقاومت ویژه دمای محیط نمونه‌ها با افزایش میزان ناخالصی تقویت کننده در مقادیر کم ناخالصی تقویت کننده سریم کاهش یافته و به یک مینیمم می‌رسد. با افزایش بیشتر سریم، مقاومت دوباره افزایش می‌یابد.

## تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایتهای قطب علمی فرآیندهای نوین ساخت و شکل دهی مواد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف و کلیه کسانی که در انجام این پروژه مرا یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

## منابع و مراجع

1. W. Heywang "Resistivity Anomaly in Doped Barium titanate" J. American Ceram, Soc, 47[10], 484-490, 1965.
2. J. Daniels, K.H. Hardtle & R. wernike "The PTC Effect of Barium titanate", Philips, Technical Research report. 38, 73-82-1978.
3. A. Aldob and B. vernonl "Grain Boundary oxidation in PTCR Barium titanate thermistors" J. Am. Ceram. Soc. 76[2], 401-408. 1993.
4. B. Huyvrechts, k. Oshizaki and M. Takata, "The positive temperature coefficient of Resistivity in Barium Titanate". J. mater. Sc, 30, 2463, 2474, 1995.
5. A.J. Moulson & S. Herbert. "Electro ceramic materials. Properties, application", Chapman Hall, 1990.
6. A. Amin, "Piezoresistivity in semiconducting positive Temperature Coefficient ceramics". Am. Cerm. Soc, 72[3] 364-376, 1984.
7. G. H. Jonker, "Equilibrium Barriers in PTC thermistors", Grain Boundary phenomena in Electronic ceramic, 1, 155-166-1981.
8. J. G . Fagan and V. R . W . Amorakon , Bullet . Am. Ceram . ,SoC. 72 [2] 69 (1993)
9. B.M. Kulwicki , Grain boundery Phenomena in Electronic Ceramics , Adv. Ceram. , 1 , 138 (1981)
10. Z.Ali nemati, Grain boundery and dopany segregation in PTCR CEramics Unpublished works, Sharif University of Technology, 2000-2005
11. Y. Gomez , C. Benitez and R.H. Balmori – Ramirez "mechanical activation of the synthesis reaction of BaTiO<sub>3</sub> from a mixture of BaCO<sub>3</sub> and TiO<sub>2</sub> powders" Ceramic International , vol. 26(3) , 271 (2000)
12. Z. Ali Nemati, M. Tabib –Azar and M.R. DeGuire, Brit. Ceram., Trans., 92 (3) –109 (1993)
13. K. Hayashi, T. Yamamoto and T. Sakuma, J. Am. Ceram. Soc. 79, 1669 (1996).
14. M. Kuwabara, K. I. Morimo and T. Matsunaga, J. Am. Ceram. Soc. 79, 997 (1996).
15. A.G. Belous, O.I. V'yunov and V.V. Kovlyaev, Effect of the dopants SiO<sub>2</sub> and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> on the phase composition and electrophysical properties of semiconducting BaTiO<sub>3</sub>. Ukr. Khim. Zhurn. 62 (1996), pp. 75–78.
16. G. H. Jonker, "Equilibrium Barriers in PTC thermistors", Grain Boundary phenomena in Electronic ceramic, 1, 155-166-1981.
17. J. Qi, Z. Gui, Y. Wang, Q. Zhu, Y. Wu and L. Li "The PTCR effect in BaTiO<sub>3</sub> ceramics modified by donor dopant", Ceramics International,28 (2002) 141–143
18. M. Kuwabara, K. Morimo and T. Matsvnaga, "Single-Grain Boundaries in PTC resistors", J. Am. Ceram. Soc, 79[4] 997-1001 (1996)
19. P. Supancic" Mechanical stability of BaTiO<sub>3</sub>-based PTC thermistor components: experimental investigation and theoretical modeling",Journal of the European Ceramic Society 20 (2000) 2009±2024
20. S. Chatterjeea, B. D. Stojanovic and H. S. Maitib "Effect of additives and powder preparation techniques on PTCR properties of barium titanate", Materials Chemistry and Physics,Volume 78, Issue 3, 28 February 2003, Pages 702-710.
21. M.H Lin and H.Y Lu "Densification retardation in the sintering of La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>doped barium titanate ceramic" Materials Science and Engineering A323 (2002) 167–176.

